

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN QUÍMICA APLICADA

**ESPECIALIDAD “MÉTODOS AVANZADOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES”
(UMA)**

Cuatrimestre	Código	Asignatura	Identificador	Créditos
1	620021	Análisis de imagen y nanoinspección	AIN	4
1	620022	Estudio de materiales por difracción de rayos X y XPS	RXPS	4
2	620023	Aplicación de técnicas de resonancia a materiales	ATRM	4
2	620024	Análisis de superficies e interfaces mediante láser	ASIL	4
2	620025	Espectroscopía vibracional y electrónica para la caracterización de materiales	EVECM	4

1 Crédito = 7.5 horas presenciales

Primer Cuatrimestre (Aula Q4)

Horas	Lunes 14 de octubre	Martes 15 de octubre	Miércoles 16 de octubre	Jueves 17 de octubre	Viernes 18 de octubre
15.00 – 16.30		AIN	AIN	AIN	
16.30 – 18.00		RXPS	RXPS	RXPS	

Horas	Lunes 21 de octubre	Martes 22 de octubre	Miércoles 23 de octubre	Jueves 24 de octubre	Viernes 25 de octubre
15.00 – 16.30	AIN	AIN	AIN	AIN	
16.30 – 18.00	RXPS	RXPS	RXPS	RXPS	

Horas	Lunes 28 de octubre	Martes 29 de octubre	Miércoles 30 de octubre	Jueves 31 de octubre	Viernes 1 de noviembre
15.00 – 16.30	AIN	AIN	AIN	AIN	TODOS LOS SANTOS
16.30 – 18.00	RXPS	RXPS	RXPS	RXPS	

Horas	Lunes 4 de noviembre	Martes 5 de noviembre	Miércoles 6 de noviembre	Jueves 7 de noviembre	Viernes 8 de noviembre
15.00 – 16.30	AIN	AIN	AIN	AIN	
16.30 – 18.00	RXPS	RXPS	RXPS	RXPS	

Horas	Lunes 11 de noviembre	Martes 12 de noviembre	Miércoles 13 de noviembre	Jueves 14 de noviembre	Viernes 15 de noviembre
15.00 – 16.30	AIN	AIN	AIN	AIN	SAN ALBERTO
16.30 – 18.00	RXPS	RXPS	RXPS	RXPS	

Horas	Lunes 18 de noviembre	Martes 19 de noviembre	Miércoles 20 de noviembre	Jueves 21 de noviembre	Viernes 22 de noviembre
15.00 – 16.30	AIN				
16.30 – 18.00	RXPS				

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN QUÍMICA APLICADA

**ESPECIALIDAD “MÉTODOS AVANZADOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES”
(UMA)**

Cuatrimestre	Código	Asignatura	Identificador	Créditos
1	620021	Análisis de imagen y nanoinspección	AIN	4
1	620022	Estudio de materiales por difracción de rayos X y XPS	RXPS	4
2	620023	Aplicación de técnicas de resonancia a materiales	ATRM	4
2	620024	Análisis de superficies e interfaces mediante láser	ASIL	4
2	620025	Espectroscopía vibracional y electrónica para la caracterización de materiales	EVECM	4

1 Crédito = 7.5 horas presenciales

Segundo Cuatrimestre (Aula Q4)

Horas	Lunes 17 de febrero	Martes 18 de febrero	Miércoles 19 de febrero	Jueves 20 de febrero	Viernes 21 de febrero
14:30 – 16.00	EVECM)	ASIL	ATRM	EVECM	
16.00 – 17.30	ATRM	EVECM	ASIL	ATRM	
17.30 – 19.00	ASIL	ATRM	EVECM)	ASIL	

Horas	Lunes 24 de febrero	Martes 25 de febrero	Miércoles 26 de febrero	Jueves 27 de febrero	Viernes 28 de FEBRERO
14:30 – 16.00	ASIL	ATRM	EVECM		DÍA DE ANDALUCÍA
16.00 – 17.30	EVECM	ASIL	ATRM		
17.30 – 19.00	ATRM	EVECM	ASIL		

Horas	Lunes 3 de marzo	Martes 4 de marzo	Miércoles 5 de marzo	Jueves 6 de marzo	Viernes 7 de marzo
14:30 – 16.00	ATRM	EVECM	ASIL	ATRM	Prácticas RMN sólidos
16.00 – 17.30	ASIL	ATRM	EVECM	ASIL	
17.30 – 19.00	EVECM	ASIL	ATRM	EVECM	

Horas	Lunes 10 de marzo	Martes 11 de marzo	Miércoles 12 de marzo	Jueves 13 de marzo	Viernes 14 de marzo
14:30 – 16.00	ATRM	EVECM	ASIL	ATRM	Visita Bionand (3h, ATRM) con (1.5 h EVECM)
16.00 – 17.30	ASIL	ATRM	EVECM	ASIL	
17.30 – 19.00	EVECM	ASIL	ATRM	EVECM	

Horas	Lunes 17 de marzo	Martes 18 de marzo	Miércoles 19 de marzo	Jueves 20 de marzo	Viernes 21 de marzo
14:30 – 16.00	EVECM	ASIL	ASIL	ASIL	Práctica SCAI (2x1.5 h EVECM) 9:30 - 12:30h
16.00 – 17.30	ATRM	EVECM (Conferencia)			
17.30 – 19.00	ASIL	ATRM			

Horas	Lunes 24 de marzo	Martes 25 de marzo	Miércoles 26 de marzo	Jueves 27 de marzo	Viernes 26 de marzo
14:30 – 16.00	ASIL				
16.00 – 17.30					
17.30 – 19.00					